

Technicien en caractérisation des matériaux à l'Institut de Recherche de Chimie de Paris (IRCP) dans l'équipe Physico-Chimie des Surfaces (PCS)

CDD 1 an

Mission

Le technicien préparera les échantillons et conduira les analyses conventionnelles de caractérisation essentiellement en spectrométrie ionique de masse en temps de vol (ToF-SIMS) et en spectroscopie de photoélectrons (XPS) selon les procédures établies par l'ingénieur de recherche en charge de la machine.

Activités

Préparer les échantillons (polissage, traitement thermique...)
Assurer les analyses par XPS et ToF-SIMS selon les procédures établies
Effectuer des opérations courantes d'entretien et de maintenance des appareillages ainsi que les dépannages de premier niveau
Tenir un cahier d'expérience
Veiller aux règles d'hygiène et de sécurité

Compétences

Maîtriser les connaissances technologiques pratiques et spécifiques à l'instrumentation des analyses de surface
Connaissances du vide et de l'ultra-vide
Notions de base sur la spectrométrie ionique de masse (SIMS) et la spectroscopie de photoélectrons (XPS)
Connaissances générales dans le domaine des matériaux (en particulier les métaux et alliages)
Savoir rédiger des notes techniques

Contexte de travail

Le technicien assurera sa mission au sein de la plateforme de caractérisation des surfaces de matériaux de l'équipe PCS de l'IRCP sous la direction des ingénieurs de recherche responsables des appareillages. Cette plateforme est constituée d'appareils de spectroscopie de photoélectrons, d'un appareillage de spectrométrie ionique de masse en temps de vol et de microscopes à champ proche (STM, AFM).

Contacts :

Antoine Seyeux, 01 44 27 80 19, antoine.seyeux@chimie-paristech.fr
Sandrine Zanna, 01 44 27 80 17, sandrine.zanna@chimie-paristech.fr
Dimitri Mercier, 01 44 27 26 75, dimitri.mercier@chimie-paristech.fr